

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2024684516

**Программа контроля дефектов полупроводниковых
пластин в фотолитографии при технологии
изготовления 350 нм с использованием CNN нейросети**

Правообладатель: **Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный технический
университет» (RU)**

Авторы: **Чирков Олег Николаевич (RU), Тамбовцев Максим
Николаевич (RU)**



Заявка № 2024683496

Дата поступления **10 октября 2024 г.**

Дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ **17 октября 2024 г.**

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 0692e761a6300bf54f240f670bca2026
Владелец **Зубов Юрий Сергеевич**
Действителен с 10.07.2024 по 03.10.2025

Ю.С. Зубов